

地質ニュース

第450号 1992年 2月

特集：二次イオン質量分析法

口 絵

二次イオン質量分析法	平田 岳史・森下 祐一
SIMS のすすめ	平田 岳史・森下 祐一・4
二次イオン質量分析計による高感度局所分析の地球化学的応用	平田 岳史・森下 祐一・西村 宏・松久 幸敬・5
SIMS 装置製作の実際と隕石中の軽元素同位体分析	西村 宏・高橋 勝・中渡瀬 武志・松濤 聡・村田 守・武司 秀夫・16
SIMS による微量元素の定量分析について	鈴木 麻里・吉岡 芳明・28
スパッタ中性粒子質量分析法 (SNMS)	島村 匡・36
二次イオン質量分析法による安定同位体比分析	
一造岩鉱物中の拡散キネティクス研究	森下 祐一・42
イオンプローブによる星間塵の同位体比測定	甘利 幸子・53
アラユルニウム・同位体顕微鏡 —SIMS による定量イメージング—	塚本 尚義・59
高分解能 SIMS への期待	富樫 茂子・67

I G C 事務局ニュース	70
学会掲示板	71
編集後記	宮崎光旗・73
豆辞典：FTIR	篠原宏志・27

表 紙

二次イオン質量分析法を用いたマグネシウムの同位体マッピング (スケールは横幅200 μ m, 測定時間5秒). 写真は Allende 炭素質隕石の高温凝縮物 (HN-3) 中にあるアノーサイト単結晶とそれに包有される鉱物である. アノーサイト, スピネル, 単斜輝石は, それぞれ Pl, Sp, Px と略記した. 疑似カラーは, 赤色ほどマグネシウム-24濃度が高いことを示す. 二次イオン質量分析法による同位体顕微鏡の開発については, 本文, 塚本による報告を参照されたい.

(文, 写真; 筑波大学地球科学系 塚本尚義)

通商産業省 工業技術院 地質調査所

〒305 茨城県つくば市東1-1-3

Tel. 0298-54-3520, Fax. 0298-54-3533

Geological Survey of Japan